

2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岸田 光哉
取 引 所 東証プライム (6594)
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太
電 話 (075) 935-6150

当社子会社の「PCIM Asia Shenzhen 2026」への出展について

ニデック株式会社のグループ会社であるニデックアドバンステクノロジー株式会社が、2026 年 8 月 26 日（水）～8 月 28 日（金）に深圳国際会展中心で開催される「PCIM Asia Shenzhen 2026」に出展しますので、お知らせいたします。

2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和

所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

「PCIM Asia Shenzhen 2026」への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 8 月 26 日（水）～8 月 28 日（金）に深圳国際会展中心で開催される「PCIM Asia Shenzhen 2026」に出展いたします。



本展示会は、電力変換・制御・供給などパワーエレクトロニクス分野の技術や製品が一堂に会する、アジア最大級のパワーエレクトロニクス専門国際展示会です。

当社ブースでは、IGBT/SiC 等の次世代パワー半導体関連の、最先端検査技術および検査製品をご紹介します。

今回は以下の主力製品を展示し、製品品質の向上に貢献するソリューションをご提案します。

〈主な展示内容〉

■ IGBT/SiC パワー半導体モジュール絶縁・静特性・動特性検査システム「NATS®-1000/1730」

パワー半導体モジュールの出荷前最終検査に最適な検査システムです。常温絶縁、高温静特性、高温動特性、常温静特性の 4 項目を並列検査可能な自動検査装置のほか、研究開発段階で活躍する手動検査装置もご紹介します。

■ IGBT/SiC パワー半導体内蔵 PCB 検査システム「NATS®-2120」

大電力・高電圧を扱うパワー半導体を実装したプリント基板やモジュール向けの検査装置です。高負荷環境下で懸念される誤動作や熱破壊を未然に防ぎ、過酷な条件下でも高い製品品質を担保します。

〈出展概要〉

- ・会期：2026 年 8 月 26 日（水）～8 月 28 日（金）
- ・会場：深圳国際会展中心(宝安館)
- ・ブース：16H15
- ・公式サイト：<https://pcimasia-shenzhen.cn.messefrankfurt.com/>